MCCJEJOBAHJE KJHETUKU POCTA DAS B CUCTEMAX Mo - Si , V - Si , Mo - Al , V - Al SJEKTPOMEXAHJYECKUM METOJOM



Б.И.Фомин, А.Е.Гершинский, Е.И.Черепов, Ф.Л.Эдельман

Институт физики полупроводников СО АН СССР, 630090. Новосибирск

Аля исследования взаимодействия V.Mo.Al между сосой и ченокристаллом кремния использован электрохимический метод /1/.

Электрохимический метод основан на том хорошо известном факте, что различные материалы (металлы, интерметаллические соединения, полупроводники) обладает в данном электролите различными по величине электрохимическими потенциалами. Следсвательно, при переходе фронта растворения через границу раздела двух материалов можно наблюдать скачок потенциала или тока растворения в зависимости от используемой схемы. Толения каждого слоя находится из закона Фарадея по количеству электричества, затраченному на растворение каждого слоя. Идентирижация образующихся в системе фаз производилась методом электронной дифракции на просвет.

Образин для исследований систем Mo-Si . V-Si приготавливались напылением в вакуме $\sim 3\cdot 10^{-6}$ торр на пластины Si . Непосредственно перед помещением в вакумную камеру пластины Si кипятились в смеси ($HCl:H_iO_i=1.100$), травились в HF и промывались в денонизованной воде. В области температур $500+600^{\circ}$ С в системах Mo-Si и V-Si отмечен рост фаз MoSi, и VSi, . Температурная зависимость констант роста фаз MoSi, и VSi, опись затся уравнением Аррениуса: $R_{VSi} = 7.95\cdot 10^{\circ}$ сиссе.

 $R_{YSi_2} = 7.95 \cdot 10^6 \exp(-\frac{12}{RT}) \text{ cm}^2 \cdot \text{cer}^4$ $R_{YSi_2} = 1.43 \cdot 10^6 \exp(-\frac{122}{RT}) \text{ cm}^2 \cdot \text{cer}^4$

Образцы для исследований систем Mo^{-Al} , V^{-Al} приготавливались напылением в вакууме последовательно Mo или V, в затем Al не термически окисленные пластины Si В системе V-Al в области температур 350+500°С отмечен рост фаз V_Al , и VAl, Фази V_Al , и VAl, во времени отжига растут по параболическому закону. Для констант роста получена температурная зависимость:

$$I_{Y_{AR_{0}}} = 4.7 \cdot 10^{8} \exp\left(-\frac{3.4}{R_{0}}\right) \cos^{8} \cos^{4}$$

$$I_{Y_{AR_{0}}} = 8 \cdot 10^{18} \exp\left(-\frac{3.5}{R_{0}}\right) \cos^{8} \cos^{4}$$

Отмечено, что поведение системи V-AC в существенной степени определнется барьерным слоем, который может обравованаться на V в процессе приготовления образцов.

В системе $\mathcal{H}o-Al$ в области температур 500+600°С отмечен рост фаз $\mathcal{H}oAl$, и $\mathcal{H}oAl$. С течением времени откита изменяется скорость роста фаз $\mathcal{H}oAl$. и $\mathcal{H}oAl$. в также энергия активации процесса роста с 3,7 эВ до \sim 2,5 эВ. Этот факт обсуждается с позиций влияния на процесс роста фаз кринизны поверхности зерна при размерах зерен, близких к размеру критического зародиша. Температурная зависимость усредненных констант роста фаз $\mathcal{H}oAl$. и $\mathcal{H}oAl$. на начальном участке описывается уравнением Аррениуса:

$$K_{Mode,} = 3.2 \cdot 10^4 \exp\left(-\frac{37}{RT}\right) \cos^2 \cos^{-1}$$
 $K_{Mode,} = 10^9 \exp\left(-\frac{32}{RT}\right) \cos^2 \cos^{-1}$

ЛИТЕРАТУРА

1 A.E. Gershinskii, A.A. Khozomenko and Cherepov E.J. Phys. state solla), 31, 81, (1975).